

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-15047-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 13.07.2026

Ausstellungsdatum: 13.07.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-15047-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Gigahertz Optik GmbH
An der Kälberweide 12, 82299 Türkenfeld

mit dem Standort

Gigahertz Optik GmbH
An der Kälberweide 12, 82299 Türkenfeld

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen

Optische Messgrößen

- Photometrie

- Radiometrie

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A).

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des Prüflaboratoriums.

Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand	Titel der Norm oder des Prüfverfahrens	Einschränkungen zum Prüfverfahren
CIE 63 1984	The Spectroradiometric Measurement of Light Sources	Prüfung der Bestrahlungsstärke von Strahlern, Leuchten und Halbleiterlichtquellen im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm Spektraler Strahlungsfluss (Strahlungsleistung) im Wellenlängenbereich von 350 nm bis 1050 nm Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 250 nm bis 2500 nm
CIE 84 1989	The measurement of luminous flux	Lichtstrom von elektrisch betriebenen Strahlern / Messung mit einer Ulbricht'schen Kugel unter Anwendung von Korrekturtechniken / Messung durch Integration der Beleuchtungsstärkeverteilung
CIE 127 2007	Measurement of LEDs	Lichtstrom von LED / Messung mit einer Ulbricht'schen Kugel unter Anwendung von Korrekturtechniken
CIE 202 2011	Spectral responsivity measurement of detectors, radiometers and photometers	Prüfung von Schmal- und Breitband-radiometer im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm

Norm oder Prüfverfahren / Ausgabestand	Titel der Norm oder des Prüfverfahrens	Einschränkungen zum Prüfverfahren
CIE 210 2014	Photometry Using V(lambda)-Corrected Detectors as Reference and Transfer Standards	Beleuchtungsstärke / Lichtmessung Photometer
CIE 220 2016	Characterization and Calibration Methods of UV Radiometers	Prüfung von Schmal- und Breitband-radiometer im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm
DIN 5031-11 2011-04	Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik Teil 11: Radiometer zur Messung aktinischer Strahlungsgrößen- Begriffe, Eigenschaften und deren Kennzeichnung	Prüfung von Schmal- und Breitband-radiometer im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm
DIN EN 13032-1 2012-06	Licht und Beleuchtung - Messung und Darstellung photometrischer Daten von Lampen und Leuchten - Teil 1: Messung und Datenformat; Deutsche Fassung EN 13032-1:2004+A1:2012	Lichtstrom von elektrisch betriebenen Strahlern / Messung mit einer Ulbricht'schen Kugel unter Anwendung von Korrekturtechniken / Messung durch Integration der Beleuchtungsstärkeverteilung Leuchtdichte und spektrale Strahldichte im Wellenlängenbereich von 250 nm bis 2500 nm
ASTM G130-12	Standard Test Method for Calibration of Narrow- and Broad-Band Ultraviolet Radiometers Using a Spectroradiometer	Prüfung von Schmal- und Breitband-radiometer im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm
ASTM G138-12	Standard Test Method for Calibration of a Spectroradiometer Using a Standard Source of Irradiance	Spektralradiometer / Geräteeigenschaften bei definierter Geräteeinstellung / Prüfung der spektralen Bestrahlungsstärke im Wellenlängenbereich von 200 nm bis 2500 nm

Verwendete Abkürzungen:

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-15047-01-01

CIE	Commission Internationale de L'Eclairage – Internationale Beleuchtungskommission
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO	International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung